

# 团 体 标 准

T/CEMIA 006—2018

---

## 膜厚监控用石英晶振片

Quartz crystal resonator for film thickness control

2018-12-14 发布

2019-03-14 实施

---

中国电子材料行业协会 发 布

中国电子材料行业协会  
团 体 标 准  
膜厚监控用石英晶振片  
T/CEMIA 006—2018

\*

中国标准出版社出版发行  
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)  
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: [www.spc.org.cn](http://www.spc.org.cn)

服务热线: 400-168-0010

2019年4月第一版

\*

书号: 155066 • 2-34127

版权专有 侵权必究

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国电子材料行业协会提出并归口。

本标准主要起草单位：唐山万士和电子有限公司、武汉海创电子股份有限公司、唐山国芯晶源电子有限公司、北京晨晶电子有限公司、江苏省东海硅产业科技创新中心。

本标准主要起草人：王丽娟、毛晶、张立强、宫桂英、李健德、李剑、李洁、陈中康、张翔。

# 膜厚监控用石英晶振片

## 1 范围

本标准规定了膜厚监控用石英晶振片的产品分类、技术要求、试验和测量方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于半导体、LED、OLED、激光红外、光学镜片器材等行业镀膜用膜厚监控石英晶振片。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 2421.1—2008 电子电工产品环境试验 概述和指南

GB/T 2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3352—2012 人造石英晶体 规范与使用指南

GB/T 12273.1—2017 有质量评定的石英晶体元件 第1部分:总规范

SJ/Z 9154.3—1987 利用有并电容  $C_0$  补偿的  $\pi$  网络相位法测量频率高达 200 MHz 的石英晶体元件两端网络参数的基本测量方法

RoHS 指令/2011/65/EU 关于在电子设备中限制使用有害物质的欧盟议会和欧盟理事会第 2011/65/EU 号指令

## 3 术语和符号

GB/T 12273.1—2017、GB/T 3352—2012 界定的术语和定义适用于本文件。

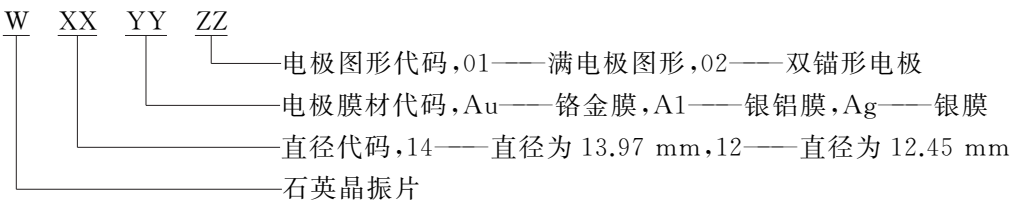
## 4 分类和标记

### 4.1 型号

按照石英晶振片外径、电极膜材料、电极形状差异分为不同型号的产品。

### 4.2 标记

产品标记方法应符合以下规定:



示例:W 14 Au01 代表直径为 13.97 mm、铬金电极、双面满电极图形石英晶振片。